

[優 秀 賞] ワイドレンジ 2次元複屈折評価システム「WPA-100」



代表取締役社長
川上 彰二郎 氏

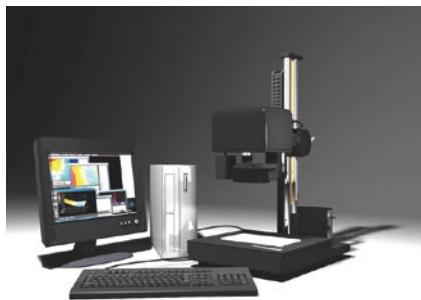
株式会社 フォトニックラティス

〒980-0845 宮城県仙台市青葉区新巻字青葉

あおばインキュベーションスクエア

TEL. 022 (726) 2076

<http://www.photonic-lattice.com/>



レンズや光学フィルムなどの光学製品の複屈折や位相差を点測定ではなく、簡単な操作で短時間に面分布として一括計測・評価するシステム。レンズのゲート近傍の大きな歪や位相差の大きなフィルムを面測定できるため、点測定では見えなかったデータのうねりや傾向が見えるようになる。

複屈折／位相差の測定には偏光計測技術が欠かせないが、従来の偏光計測技術は、回転する偏光フィルターを通過した光量の変化を測定するため、回転のための駆動系や測定時間を要していた。これ

に対して、独自のフォトニック結晶技術で作られた微細な4種類の波長板からなる集積偏光フィルターを撮像素子に精密実装した偏光イメージセンサーの採用により、複屈折の面分布情報が瞬時に得られる。また、新開発のワイドレンジ型偏光イメージセンサーと複数の波長フィルターを組み合わせ、波長ごとに位相差比較をすることにより、数千nmまでの位相差測定を実現した。そのうえ、最先端の高度な解析アルゴリズムを組み込んでおり、簡単な操作と多彩な表示機能およびグラフ機能をもつ。ワイドレンジに複屈折を計測できるため、材質、製法、形状によらず広範な光学製品に適用できる。